

Томский политехнический  
университет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  
И РЕЙТИНГ ПЛАН  
( Технологическая карта )

Число недель 17

Объем в часах

Аудиторные занятия      Самостоятельные занятия

Лекции	18	18
Практ.	10	17
Итого:	28	35

Дисциплина *Метрология, стандартизация и сертификация*

Кафедра *АТП*

Факультет *Теплоэнергетический*

Группа *6271-6272* на *осенний* семестр *2009/2010* уч. года

Лектор *к.т.н., доцент Волошенко Александр Викторович*

Виды, содержание занятий и объем в часах аудиторных (а) и самостоятельных (с) занятий

Неделя	Лекции (порядковый номер, тема)	Часы		Балл	Практические занятия (ПР) Лабораторные занятия (ЛБ)	Часы Балл		
		а	с			а	с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МОДУЛЬ №1							
1	1. Предмет и задачи метрологии. Термины и определения.	2	2	60				
3	2. Классификация измерений. Методы измерений.	2	2	60				
5	3. Классификация погрешностей измерений.	2	2	60				
7	4. Классификация СИ. Погрешности СИ.	2	2	60				
9	5. Нормирование метрологических характеристик.	2	2	60	ПР1. Расчет погрешностей СИ.	2	3	60
10								
11	6. Оценка результата прямых измерений с однократными и многократными наблюдениями.	2	2	60	ПР2. Оценка статической погрешности ИС ТЭП – милливольтметр.	2	3	60
12								
13	7. Закон РФ о единстве измерений. Структуры и функции метрологических служб.	2	2	60	ПР3. Оценка статической погрешности ИС ТЭП – автоматич. потенциалом.	2	3	60
1	2	3	4	5	6	7	8	9

14								
15	8. Правовые основы и научная база стандартизации.	2	2	60	ПР4. Обработка результатов многократных измерений.	2	4	60
16								
17	9. Цели, объекты, схемы и системы сертификации.	2	2	60	ПР5. Обработка результатов многократных измерений.	2	4	60
СУММАРНЫЙ БАЛЛ МОДУЛЯ № 1		18	18	540		10	17	300

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учеб. пособие. – М.: Логос, – 2001. – 536 с.
2. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учебн. пособие для вузов. – М.: Логос, 2000. – 408 с.
3. Сергеев А.Г., Латышев М. В. Сертификация: Учебное пособие. - М.: Логос, 2000. - 248 с.
4. Шишкин И.Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 320 с.

Подпись лектора, составившего учебно-методическую карту

\_\_\_\_\_ А.В.Волошенко  
 “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2009 г.